

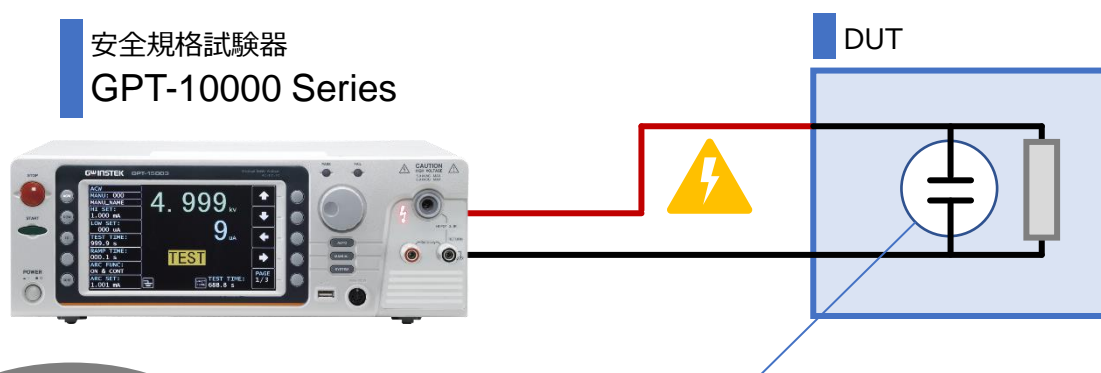
容量性負荷への安全規格試験

安全規格試験器「GPT-10000シリーズ」は、EMIフィルタや電圧依存性のあるセラミックコンデンサ等が接続された容量の大きな負荷（容量性負荷）であっても安定して試験を行うことが可能です。

point

- ・従来の安全規格試験器では、容量性負荷の試験は電圧を安定させることが厳しい
- ・GPT-10000/9500シリーズは、かねてより要求の多かった容量性負荷の試験を大幅に強化

接続イメージ



製造する製品が替
わる度に試験でき
るか心配…



従来モデルや他社製品などでも、容量性負荷への試験では

- ・ランプ時間を長くする
- ・試験時間の検出に遅延を設ける
- ・特殊なトランス容量を持った大型の安全規格試験器を用意する
- ・接続経路（治具）の寄生容量を抑える

などの対策を行うことが多くありました。



試験条件（安定した試験が可能な容量上限）

試験電圧(DCW)	Hi-Set電流	ランプ上昇時間	最大容量性負荷
1.000kV	$I \geq 10.00\text{mA}$	$T \geq 1.0\text{s}$	4.7 μF
2.000kV	$I \geq 7.00\text{mA}$	$T \geq 1.0\text{s}$	1.65 μF
3.000kV	$I \geq 8.00\text{mA}$	$T \geq 1.0\text{s}$	1.32 μF
4.000kV	$I \geq 11.00\text{mA}$	$T \geq 1.0\text{s}$	1.32 μF
5.000kV	$I \geq 7.00\text{mA}$	$T \geq 1.0\text{s}$	0.66 μF
6.000kV	$I \geq 8.00\text{mA}$	$T \geq 1.0\text{s}$	0.66 μF

容量性が強化され、
明確な試験条件表
記があると導入し
やすい！

